

TCカレッジ 中級カリキュラム「走査電子顕微鏡」

【目的】SEMの基本操作を学ぶ

【日程】2022年10月5日、6日

【装置】VE9800(キーエンス)JSM-7500F(日本電子)JXA-8530F(日本電子)

【講師】東京工業大学 多田

【場所】ハイブリッド(東工大大岡山キャンパス南7号館301号室/zoom)

【協力】日本電子株式会社

「SEM」中級カリキュラム日程

1日目:10月5日(水)ハイブリッド

9:00-12:00 カリキュラム概略説明、装置立ち上げ、
試料導入、二次電子像観察

12:00-13:00 休憩

13:00-16:00 試料調整、FE-SEM観察、電子光学軸調整

2日目:10月6日(木)ハイブリッド

9:00-12:00 二次電子像の解釈、加速電圧・WDと像出

12:00-13:00 休憩

13:00-16:00 反射電子とEDS、二次電子と反射電子の比較、
SEM-EDS分析、EDSマッピング



VE9800
(キーエンス)